

REF20xx 低ドリフト、低消費電力、デュアル出力、 V_{REF} および $V_{REF}/2$ 基準電圧

1 特長

- V_{REF} および $V_{REF}/2$ という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
- 優れた温度ドリフト性能:
 - -40°C から 125°C について $8\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値)
- 高い初期精度: $\pm 0.05\%$ (最大値)
- 温度範囲全体にわたる V_{REF} および V_{BIAS} トラッキング:
 - -40°C から 85°C について $6\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値)
 - -40°C から 125°C について $7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値)
- 超小型パッケージ: SOT23-5
- Low ドロップアウト電圧: 10mV
- 大出力電流: $\pm 20\text{mA}$
- 低い静止電流: $360\mu\text{A}$
- ラインレギュレーション: $3\text{ppm}/\text{V}$
- 負荷レギュレーション: $8\text{ppm}/\text{mA}$
- マットスズメッキバージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化

2 アプリケーション

- 電気メータ
- アナログ入力モジュール
- アナログ出力モジュール
- サーボドライブ制御モジュール
- サーキットブレーカ (ACB, MCCB, VCB)
- 医療用デジタル温度計
- 実験室およびフィールド向け計測機器
- バッテリ試験装置

3 説明

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合にアナログ/デジタルコンバータ(ADC)入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (V_{REF})、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (V_{BIAS}) を供給します。

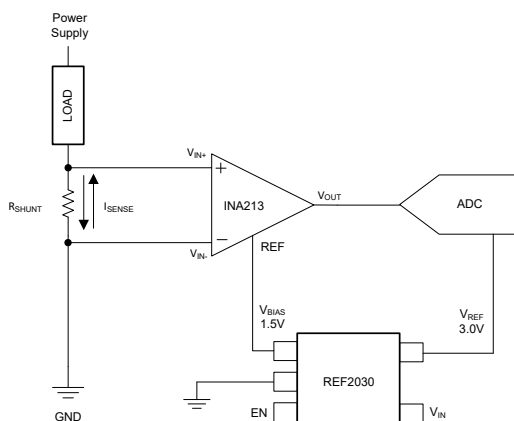
REF20xx は、 V_{REF} および V_{BIAS} の出力に対する温度ドリフト (最大 $8\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、 $430\mu\text{A}$ 未満の静止電流で動作します。さらに、 V_{REF} および V_{BIAS} 出力は、 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ の温度範囲にわたって、 $6\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度が向上し、基板面積が削減されるほか、ディスクリットソリューションと比較してシステムのコストを低減することができます。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリー動作のシステムでは非常に有用です。

V_{REF} および V_{BIAS} 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズレベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに適した設計となっています。

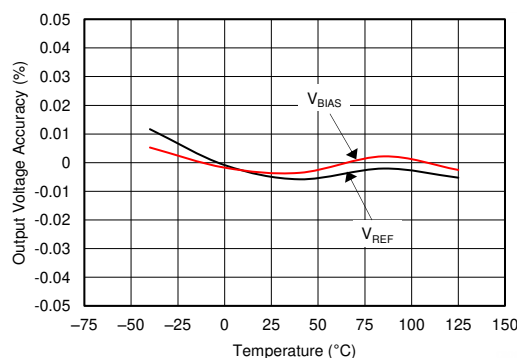
パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージサイズ (2)
REF20xx	DCC (SOT-23, 5)	$2.90\text{mm} \times 1.60\text{mm}$

- (1) 詳細については、[セクション 12](#) を参照してください。
- (2) パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



アプリケーションの例



V_{REF} および V_{BIAS} と温度との関係



目次

1 特長.....	1	8.1 概要.....	18
2 アプリケーション.....	1	8.2 機能ブロック図.....	18
3 説明.....	1	8.3 機能説明.....	18
4 デバイス比較表.....	3	8.4 デバイスの機能モード.....	19
5 ピン構成および機能.....	4	9 アプリケーションと実装.....	20
6 仕様.....	5	9.1 使用上の注意.....	20
6.1 絶対最大定格.....	5	9.2 代表的なアプリケーション.....	21
6.2 ESD 定格.....	5	9.3 電源に関する推奨事項.....	25
6.3 推奨動作条件.....	5	9.4 レイアウト.....	25
6.4 熱に関する情報.....	5	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	27
6.5 電気的特性.....	6	10.1 ドキュメントのサポート.....	27
6.6 代表的特性.....	7	10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	27
7 パラメータ測定情報.....	15	10.3 サポート・リソース.....	27
7.1 半田付けの熱による変動.....	15	10.4 商標.....	27
7.2 長期安定性.....	16	10.5 静電気放電に関する注意事項.....	27
7.3 熱ヒステリシス.....	16	10.6 用語集.....	27
7.4 ノイズ性能.....	17	11 改訂履歴.....	27
8 詳細説明.....	18	12 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	28

4 デバイス比較表

製品名	V_{REF}	V_{BIAS}
REF2025	2.5V	1.25V
REF2030	3.0V	1.5V
REF2033	3.3V	1.65V
REF2041	4.096V	2.048V

5 ピン構成および機能

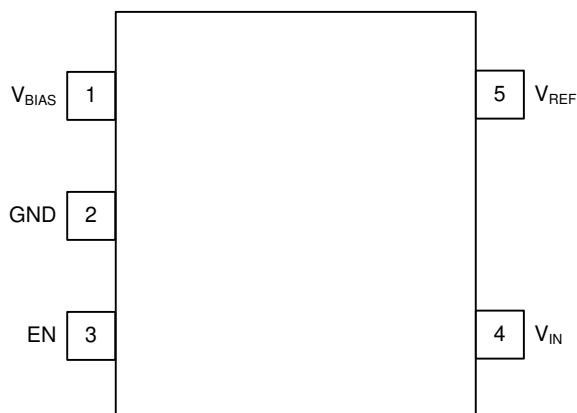


図 5-1. DDC パッケージ SOT23-5 (上面図)

ピン		I/O	説明
番号	名称		
1	V _{BIAS}	出力	バイアス電圧出力 (V _{REF} /2)
2	GND	—	グラウンド
3	EN	入力	イネーブル (EN ≥ V _{IN} – 0.7V、デバイスはイネーブル)
4	V _{IN}	入力	入力電源電圧
5	V _{REF}	出力	基準電圧出力 (V _{REF})

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
入力電圧	V_{IN}	-0.3	6	V
	EN	-0.3	$V_{IN} + 0.3$	
温度	動作	-55	150	°C
	接合部、 T_j		150	
	保存、 T_{stg}	-65	170	

- (1) 「絶対最大定格」外での動作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本デバイスが正しく機能することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、デバイスは完全に機能するとは限らず、このことがデバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

6.2 ESD 定格

		値	単位
$V_{(ESD)}$ 静電放電	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 ⁽¹⁾	±2500	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠 ⁽²⁾	±1500	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

	最小値	公称値	最大値	単位
V_{IN} 電源入力電圧範囲 ($I_L = 0\text{mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)	$V_{REF} + 0.02$ ⁽¹⁾		5.5	V

- (1) さまざまな負荷電流および温度における最小入力電圧については、[セクション 6.6](#) の [図 6-28](#) を参照してください。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		REF20xx	単位
		DDC (SOT23)	
		5 ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	193.6	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	40.2	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	34.5	°C/W
Ψ_{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.9	°C/W
Ψ_{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	34.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	接合部からケース (底面) への熱抵抗	該当なし	°C/W

- (1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

6.5 電気的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $I_L = 0\text{mA}$ 、 $V_{IN} = 5\text{V}$ 、(特に記述のない限り)。 V_{REF} と V_{BIAS} の仕様は同じ。

パラメータ		テスト条件		最小値	標準値	最大値	単位
精度とドリフト							
出力電圧精度				-0.05%		0.05%	
出力電圧の温度係数 ⁽¹⁾		-40°C ≤ T _A ≤ 125°C			±3	±8	ppm/°C
温度範囲全体にわたる V _{REF} と V _{BIAS} のトラッキング ⁽²⁾		-40°C ≤ T _A ≤ 85°C			±1.5	±6	ppm/°C
		-40°C ≤ T _A ≤ 125°C			±2	±7	
ラインおよび負荷のレギュレーション							
ΔV _{O(ΔVI)} ライン レギュレーション		V _{REF} + 0.02V ≤ V _{IN} ≤ 5.5V			3	35	ppm/V
ΔV _{O(ΔIL)} ロード レギュレーション	ソース	0mA ≤ I _L ≤ 20mA、V _{REF} + 0.6V ≤ V _{IN} ≤ 5.5V			8	20	ppm/mA
	シンク	0mA ≤ I _L ≤ -20mA、V _{REF} + 0.02V ≤ V _{IN} ≤ 5.5V			8	20	
電源							
I _{CC} 電源電流	アクティブ モード				360	430	μA
		-40°C ≤ T _A ≤ 125°C				460	
	シャットダウン モード				3.3	5	
		-40°C ≤ T _A ≤ 125°C				9	
イネーブル電圧		デバイスはシャットダウン モード (EN = 0)		0		0.7	V
		デバイスはアクティブ モード (EN = 1)		V _{IN} - 0.7		V _{IN}	
ドロップアウト電圧					10	20	mV
		I _L = 20mA				600	
I _{SC} 短絡電流					50		mA
t _{on} ターンオン時間			0.1% セットリング、C _L = 1μF		500		μs
ノイズ							
低周波ノイズ ⁽³⁾		0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz			12		ppm _{PP}
出力電圧ノイズ密度		f = 100Hz			0.25		ppm/√Hz
容量性負荷							
安定した出力コンデンサ範囲					0	10	μF
ヒステリシスと長期安定性							
長期安定性 ⁴		0～1000 時間			25		ppm
出力電圧ヒステリシス ⁵		25°C、-40°C、125°C、25°C	サイクル 1		60		ppm
			サイクル 2		35		

(1) 温度ドリフトは、ボックス方式に従って規定されています。詳細については、[セクション 8.3](#)を参照してください。

(2) 温度範囲仕様全体にわたる V_{REF} および V_{BIAS} のトラッキングについては、[セクション 8.3](#)で詳細に説明されています。

(3) ピーク ツー ピークのノイズ測定手順については、[セクション 7.4](#)で詳細に説明されています。

(4) 長期安定性の測定手順については、[セクション 7.2](#)で詳細に説明されています。

(5) 熱ヒステリシスの測定手順については、[セクション 7.3](#)で詳細に説明されています。

6.6 代表的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$ 、2.5V 出力 (特に記述のない限り)

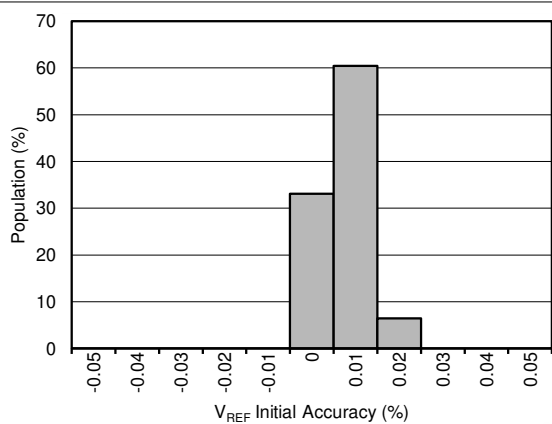
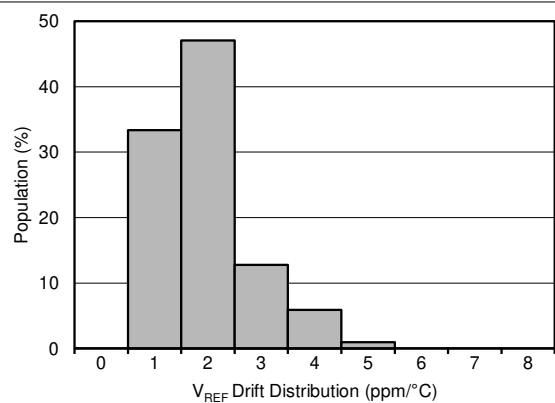


図 6-1. 初期精度の分布 (V_{REF})



$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 125^\circ\text{C}$

図 6-2. ドリフト分布 (V_{REF})

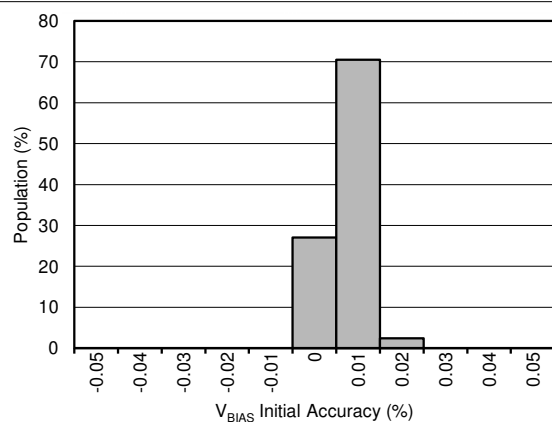
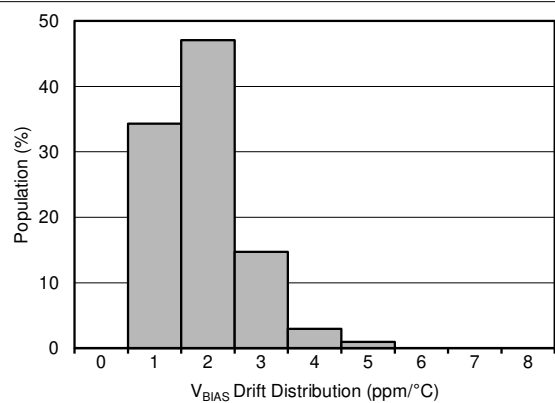


図 6-3. 初期精度の分布 (V_{BIAS})



$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 125^\circ\text{C}$

図 6-4. ドリフト分布 (V_{BIAS})

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$ 、 2.5V 出力 (特に記述のない限り)

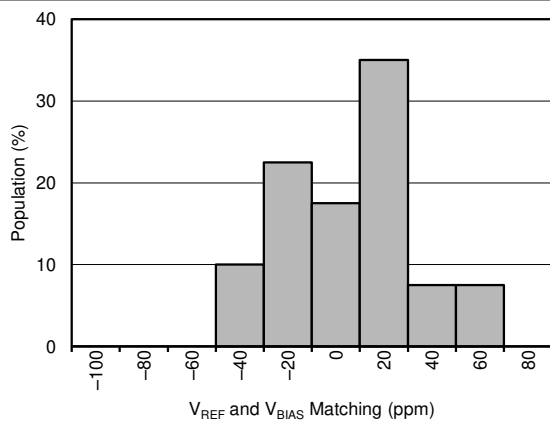
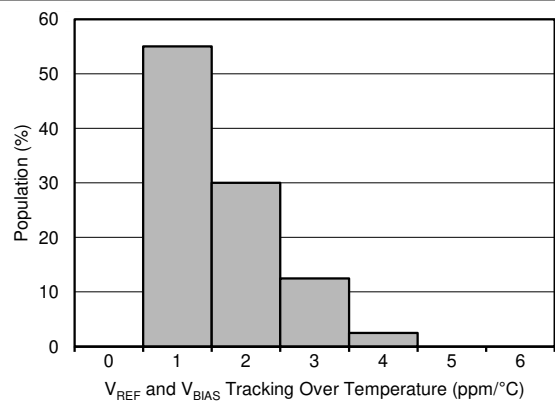
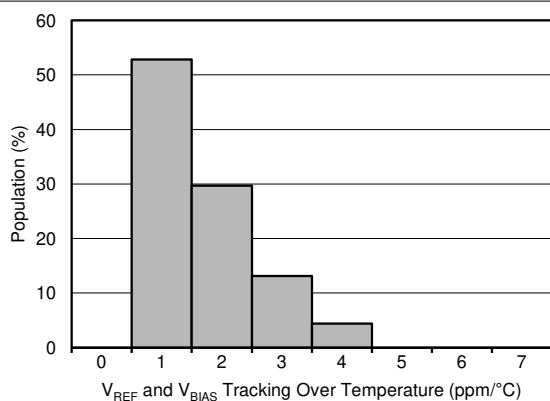


図 6-5. $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ の分布



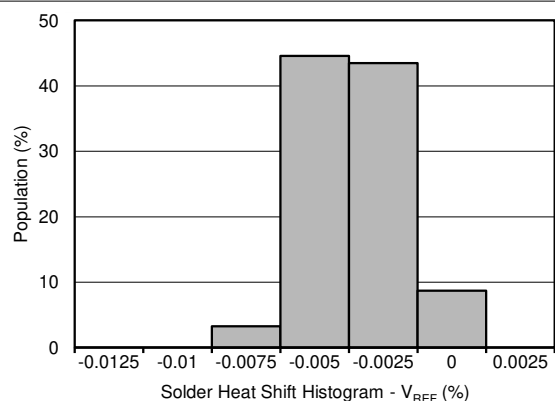
$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 85^\circ\text{C}$

図 6-6. 温度範囲全体にわたる $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ ドリフトトラッキングの分布



$-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq 125^\circ\text{C}$

図 6-7. 温度範囲全体にわたる $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ ドリフトトラッキングの分布

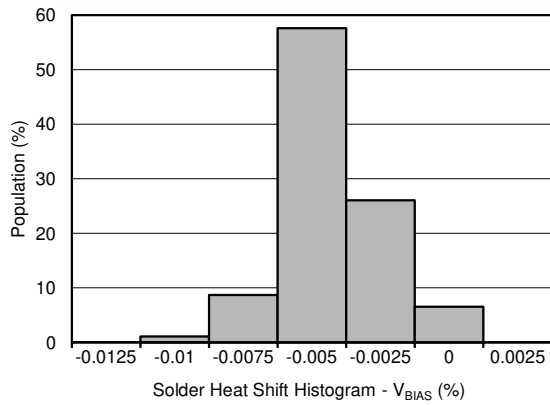


詳細については、[セクション 7.1](#) セクションを参照してください。

図 6-8. 半田付けの熱による変動 (V_{REF})

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源, $C_L = 0\mu\text{F}$, 2.5V 出力 (特に記述のない限り)



詳細については、[セクション 7.1](#) を参照してください。

図 6-9. 半田付けの熱による変動 (V_{BIAS})

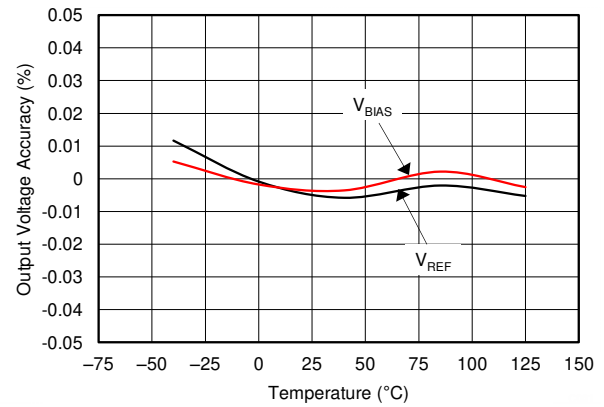


図 6-10. 出力電圧精度 (V_{REF}) と温度との関係

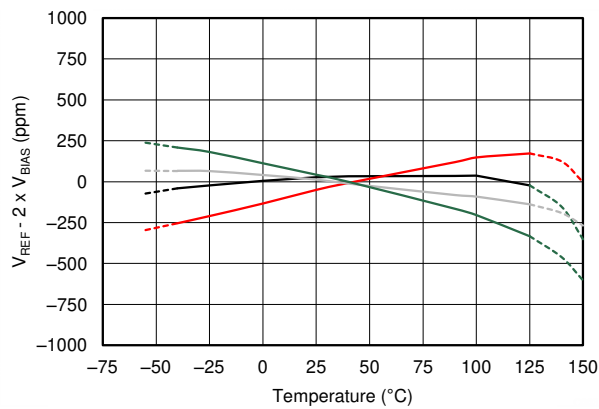


図 6-11. $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ トラッキングと温度との関係

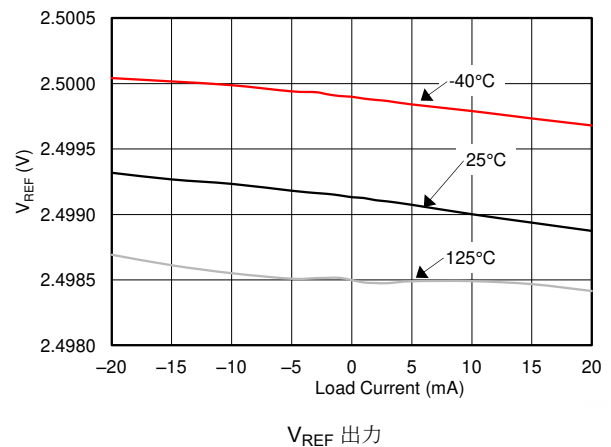


図 6-12. 出力電圧変化と負荷電流との関係 (V_{REF})

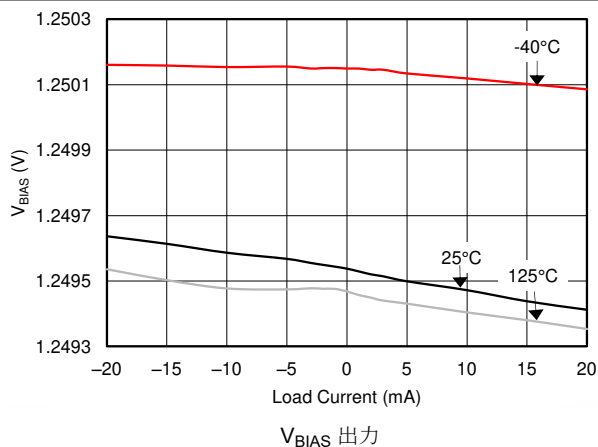


図 6-13. 出力電圧変化と負荷電流との関係 (V_{BIAS})

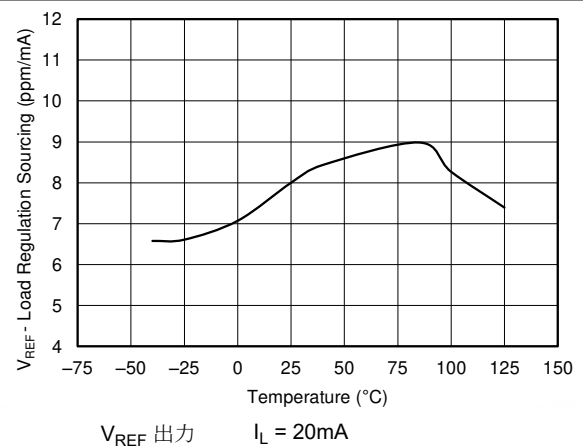


図 6-14. 負荷レギュレーション ソースと温度との関係 (V_{REF})

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源, $C_L = 0\mu\text{F}$, 2.5V 出力 (特に記述のない限り)

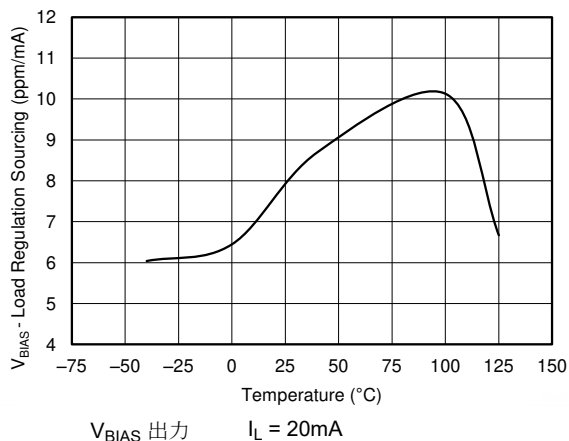


図 6-15. 負荷レギュレーション ソースと温度との関係 (V_{BIAS})

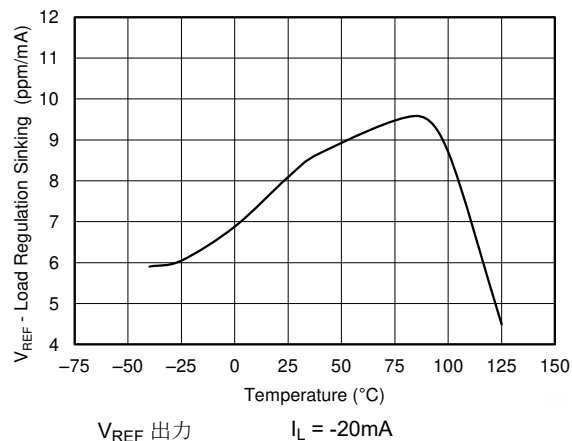


図 6-16. 負荷レギュレーション シンクと温度との関係 (V_{REF})

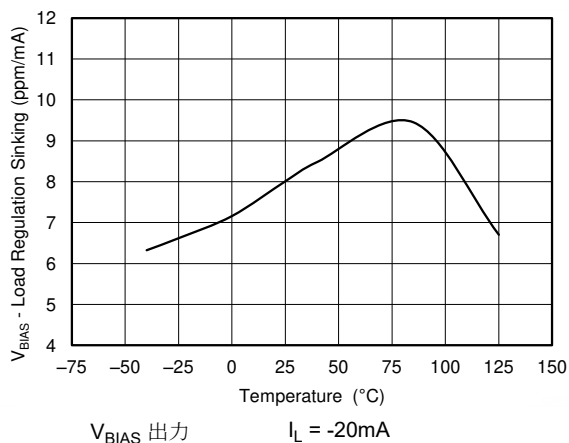


図 6-17. 負荷レギュレーション シンクと温度との関係 (V_{BIAS})

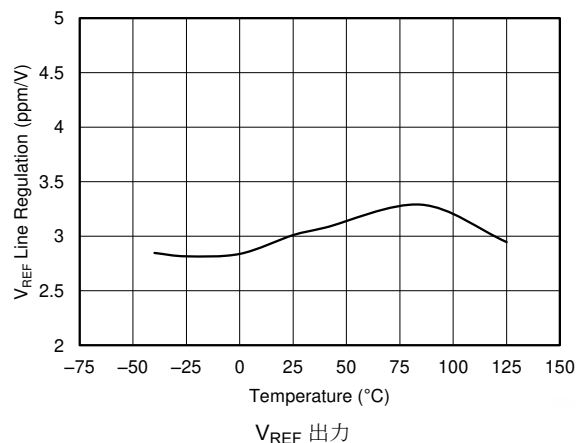


図 6-18. ラインレギュレーションと温度との関係 (V_{REF})

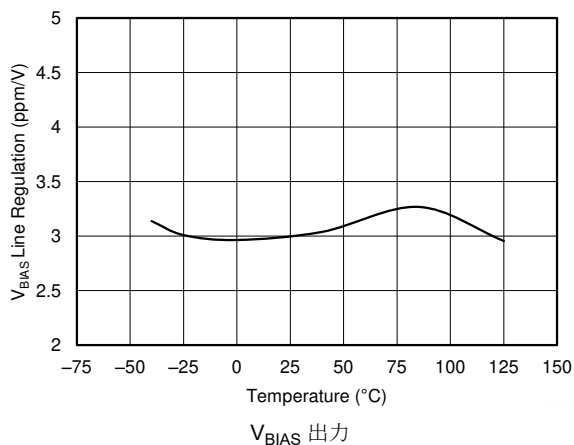


図 6-19. ラインレギュレーションと温度との関係 (V_{BIAS})

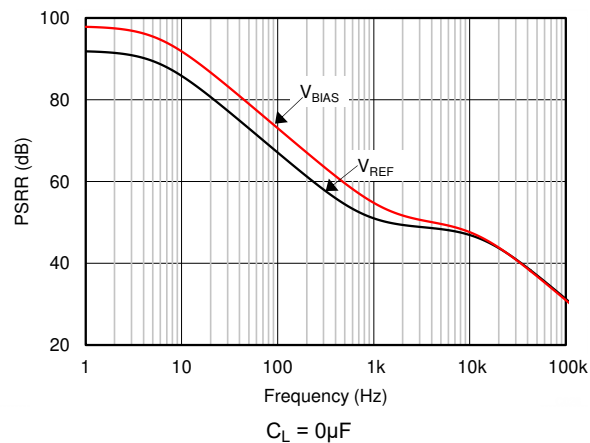


図 6-20. 電源除去比と周波数との関係

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$, 2.5V 出力 (特に記述のない限り)

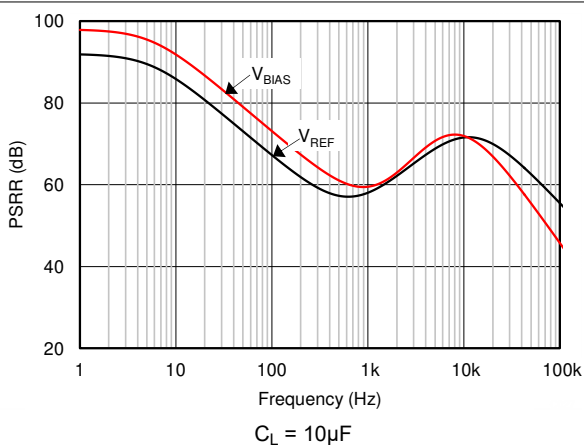
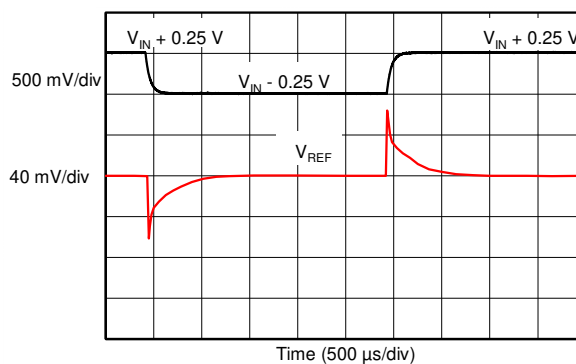
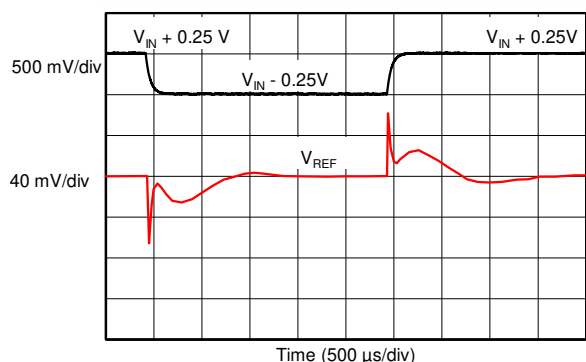


図 6-21. 電源除去比と周波数との関係



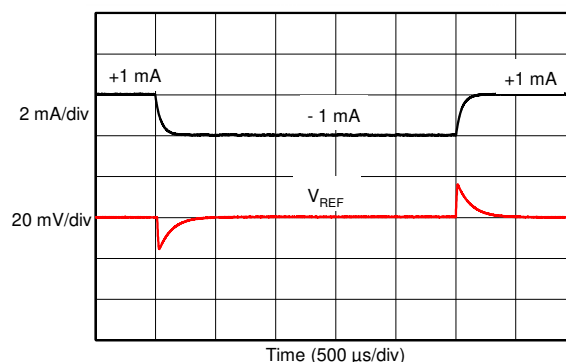
$C_L = 1\mu\text{F}$

図 6-22. ライン過渡応答



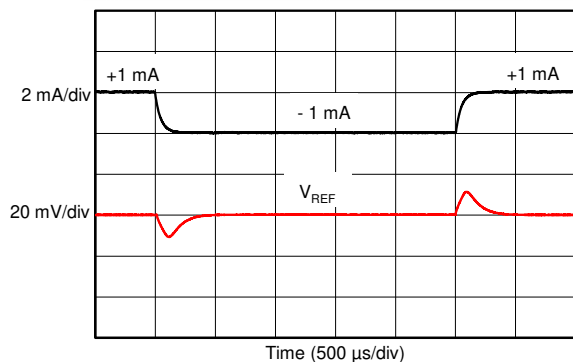
$C_L = 10\mu\text{F}$

図 6-23. ライン過渡応答



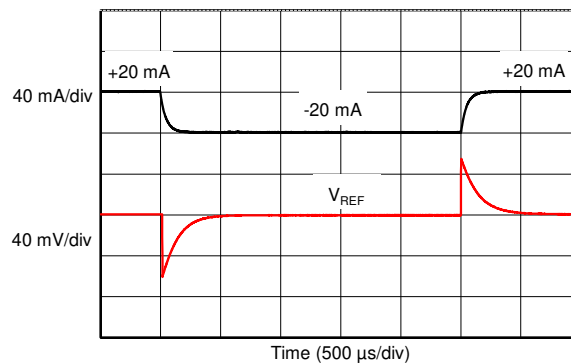
$C_L = 1\mu\text{F}$ $I_L = \pm 1\text{mA}$ ステップ

図 6-24. 負荷過渡応答



$C_L = 10\mu\text{F}$ $I_L = \pm 1\text{mA}$ ステップ

図 6-25. 負荷過渡応答

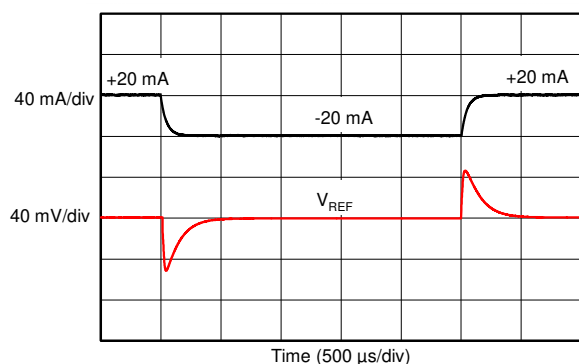


$C_L = 1\mu\text{F}$ $I_L = \pm 20\text{mA}$ ステップ

図 6-26. 負荷過渡応答

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$, 2.5V 出力 (特に記述のない限り)



$C_L = 10\mu\text{F}$ $I_L = \pm 20\text{mA}$ ステップ

図 6-27. 負荷過渡応答

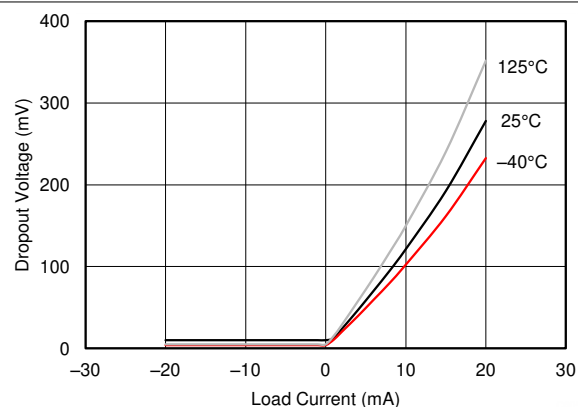
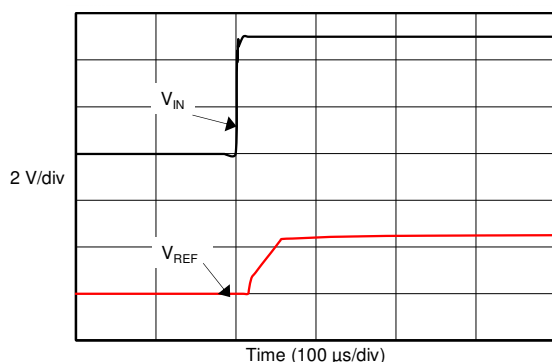
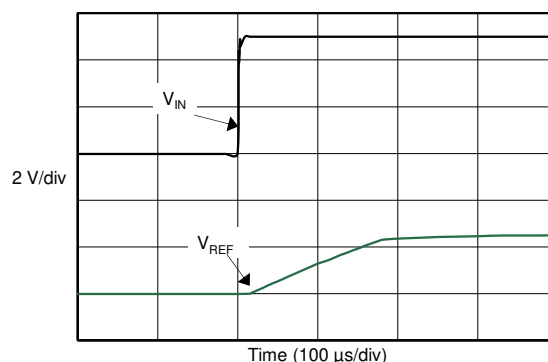


図 6-28. 最小ドロップアウト電圧と負荷電流との関係



$C_L = 1\mu\text{F}$

図 6-29. ターンオンのセトリング タイム



$C_L = 10\mu\text{F}$

図 6-30. ターンオンのセトリング タイム

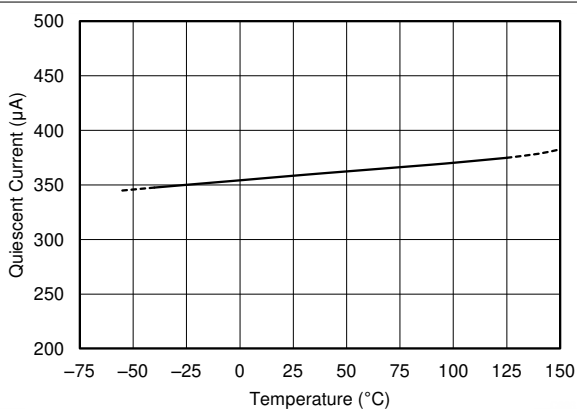


図 6-31. 静止電流と温度との関係

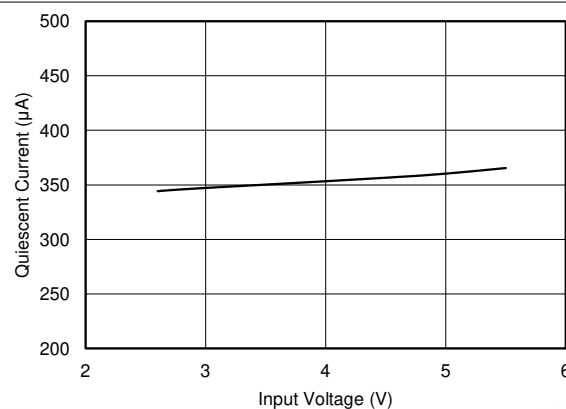
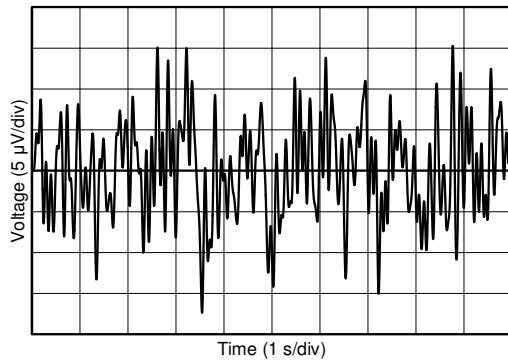


図 6-32. 静止電流と入力電圧との関係

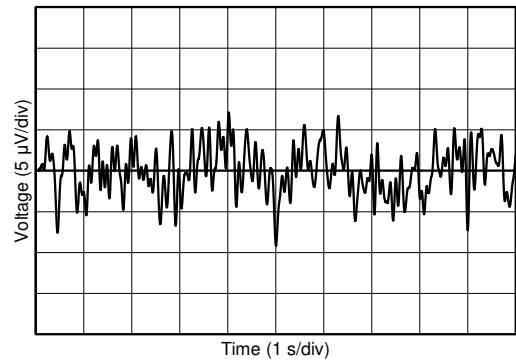
6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_L = 0\text{mA}$, $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$, 2.5V 出力 (特に記述のない限り)



V_{REF} 出力

図 6-33. 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ (V_{REF})



V_{BIAS} 出力

図 6-34. 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ (V_{BIAS})

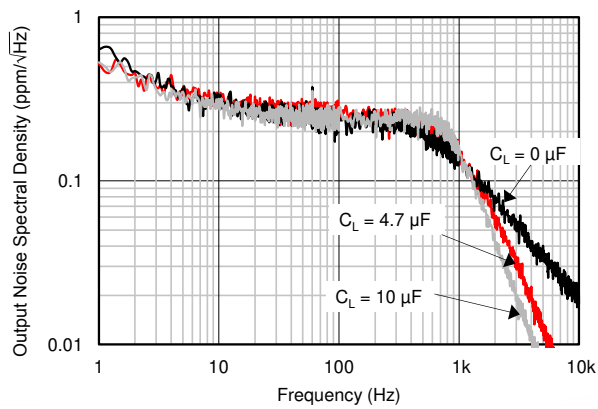


図 6-35. 出力電圧ノイズのスペクトラム

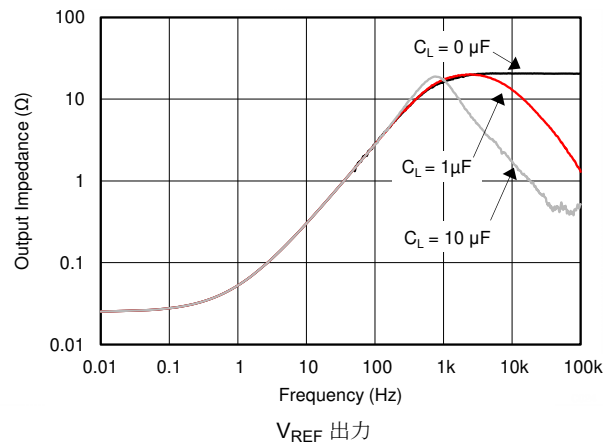


図 6-36. 出力インピーダンスと周波数との関係 (V_{REF})

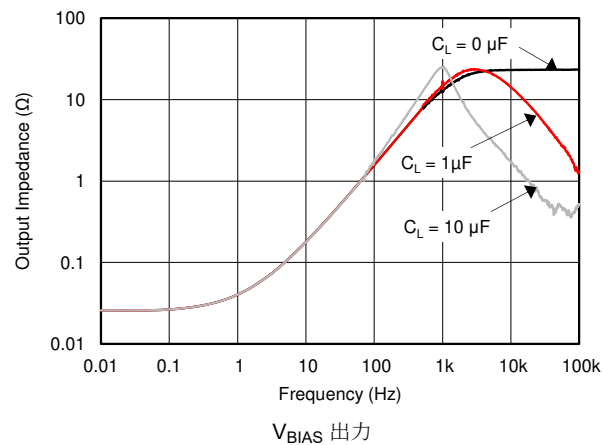


図 6-37. 出力インピーダンスと周波数との関係 (V_{BIAS})

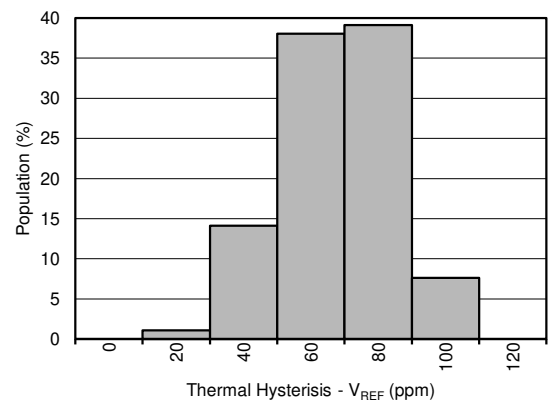


図 6-38. 熱ヒステリシスの分布 (V_{REF})

6.6 代表的特性 (続き)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $I_L = 0\text{mA}$ 、 $V_{IN} = 5\text{V}$ 電源、 $C_L = 0\mu\text{F}$ 、 2.5V 出力 (特に記述のない限り)

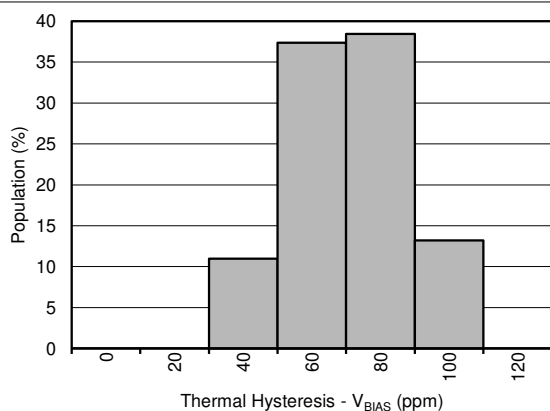


図 6-39. 熱ヒステリシスの分布 (V_{BIAS})

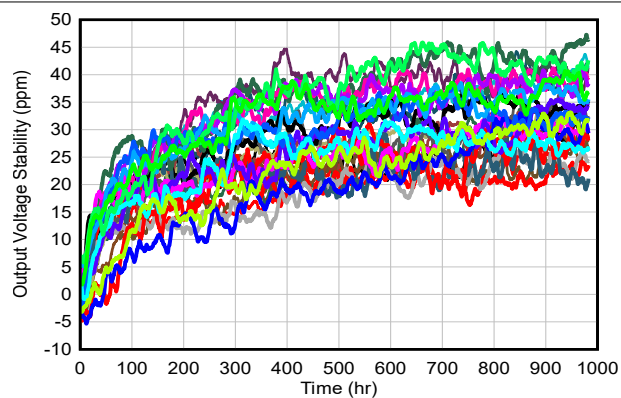


図 6-40. 長期安定性 (最初の 1000 時間)

7 パラメータ測定情報

7.1 半田付けの熱による変動

REF20xx の製造に使用される材料はそれぞれ熱膨張係数が異なるため、部品が加熱されるとデバイスのダイにストレスが生じます。デバイス ダイの機械的および熱的なストレスは、出力電圧のシフトを引き起こし、製品の初期精度仕様を低下させる可能性があります。この誤差が発生する一般的な原因は、リフローの半田付けです。

この影響を確認するため、鉛フリーの半田ペーストとペースト メーカーが推奨するリフロー プロファイルを使用して、4 枚のプリント基板に合計 92 個のデバイス [各プリント基板 (PCB) に 23 デバイス] を半田付けしました。リフロー プロファイルは、図 7-1 に示すものです。プリント基板は FR4 素材で構成されています。基板の厚さは 1.57mm、面積は 171.54mm × 165.1mm です。

基準出力電圧とバイアス出力電圧は、リフロー処理の前後で測定されます。図 7-2 および図 7-3 に、標準的なシフトを示します。テストされるユニットすべてに、わずかなシフト (< 0.01%) が出現していますが、プリント基板のサイズ、厚さ、材質によってはさらに大きなシフトが起きる可能性もあります。注意すべき重要な点は、これらのヒストグラムに示されているのは単一のリフロー プロファイルによる標準的なシフトだということです。PCB の両面に部品を表面実装する場合は、何回もリフローが行われるのが一般的で、このような場合は出力バイアス電圧がさらにシフトします。PCB にリフローが何回も行われる場合は、2 回目のパスでデバイスを半田付けすることにより、デバイスへの熱ストレスを最小限に抑える必要があります。

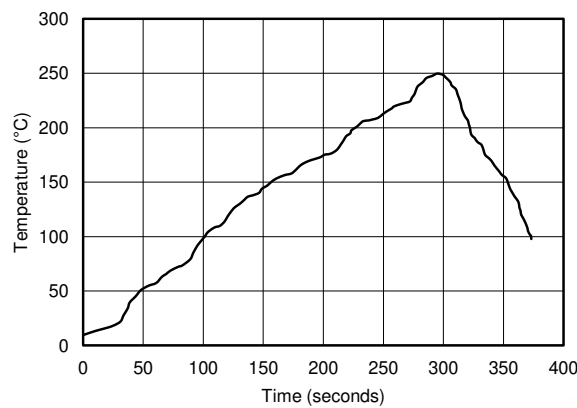


図 7-1. リフロー プロファイル

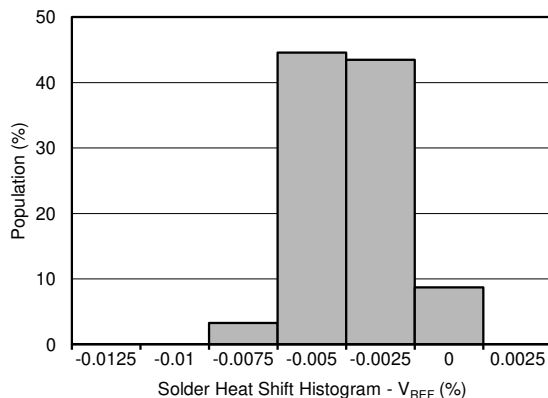


図 7-2. 半田付けの熱による変動、 V_{REF} (%)

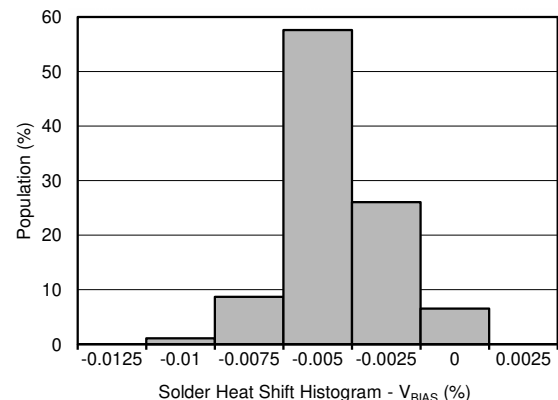


図 7-3. 半田付けの熱による変動、 V_{BIAS} (%)

7.2 長期安定性

REF20xx の長期安定性は、スロットやレイアウト上の特別な配慮をせずにプリント基板に半田付けされた 32 個の部品について測定されます。その後、基板をオープンに設置して内部温度を $T_A = 35^\circ\text{C}$ に維持し、32 個の部品の V_{REF} 出力を定期的に測定しました。図 7-4 に、長期安定性の代表値を示します。

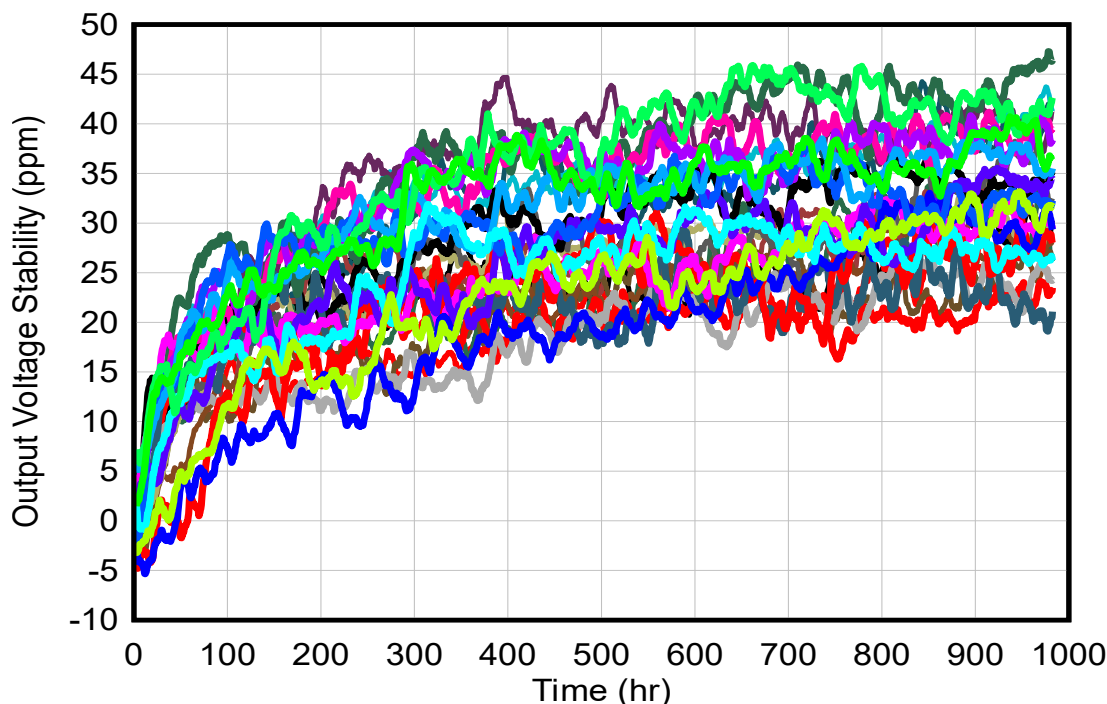


図 7-4. 長期安定性 – 1000 時間 (V_{REF})

7.3 熱ヒステリシス

熱ヒステリシスは、実際のアプリケーションと同様に REF20xx を PCB にはんだ付けして測定します。本デバイスの熱ヒステリシスは、デバイスを 25°C で動作させた後、定格温度範囲でのサイクルを繰り返し、再び 25°C に戻したときの出力電圧の変化として定義されます。ヒステリシスは、式 1 で算出できます。

$$V_{\text{HYST}} = \left(\frac{|V_{\text{PRE}} - V_{\text{POST}}|}{V_{\text{NOM}}} \right) \times 10^6 (\text{ppm}) \quad (1)$$

ここで、

- V_{HYST} = 熱ヒステリシス (ppm 単位)
- V_{PRE} = 25°C のプリ温度サイクルで測定された出力電圧
- V_{POST} = デバイスを 25°C から $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$ の定格温度範囲を経て 25°C に戻すサイクルを繰り返した後に測定された出力電圧
- V_{NOM} = 指定された出力電圧

図 7-5 および 図 7-6 に、標準的な熱ヒステリシスの分布を示します。

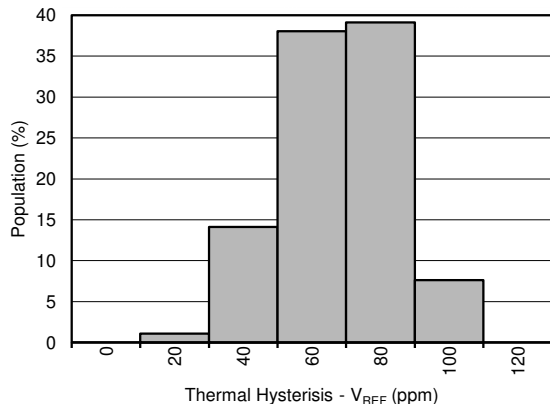


図 7-5. 熱ヒステリシスの分布 (V_{REF})

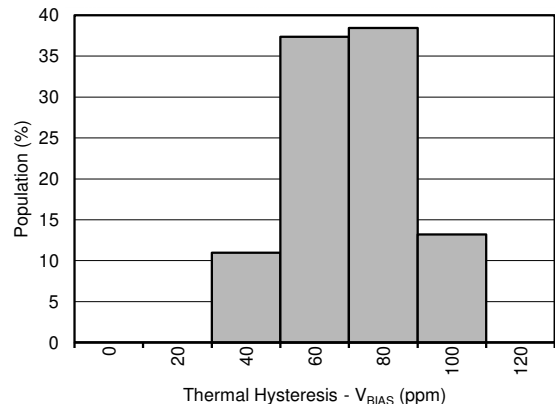


図 7-6. 熱ヒステリシスの分布 (V_{BIAS})

7.4 ノイズ性能

図 7-7 と図 7-8 に、標準的な 0.1Hz ~ 10Hz の電圧ノイズを示します。出力電圧と動作温度に応じて、デバイスのノイズが上昇します。出力ノイズレベルを向上させるには、追加のフィルタリングを使用してください。出力インピーダンスによって AC 性能が低下しないことを確認してください。図 7-9 に、ピークツーピーク ノイズ測定構成を示します。

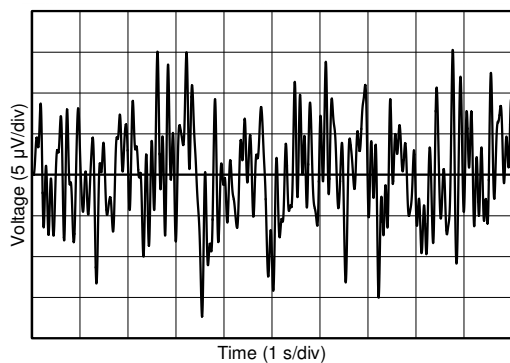


図 7-7. 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ (V_{REF})

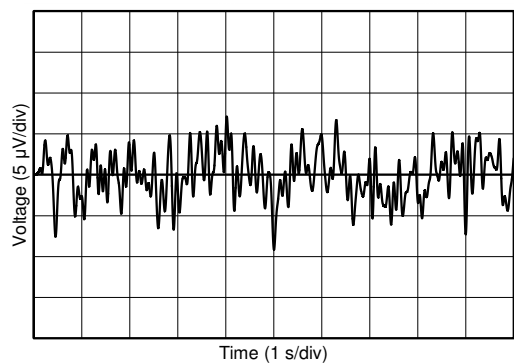


図 7-8. 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ (V_{BIAS})

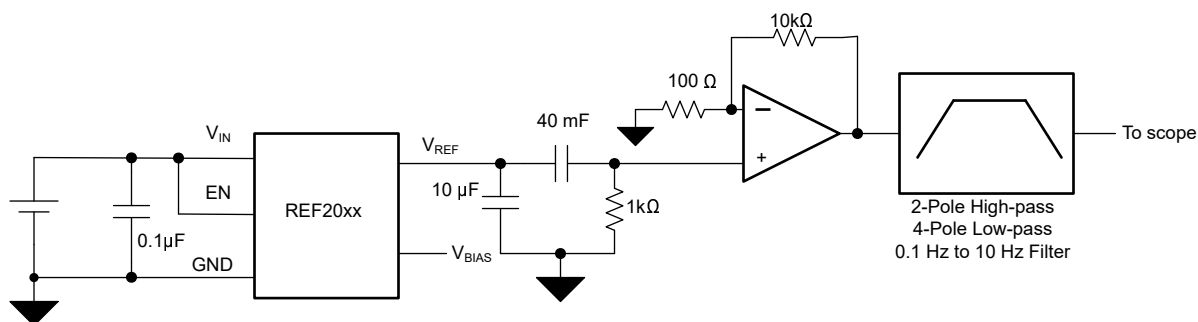


図 7-9. 0.1Hz ~ 10Hz のノイズ測定の設定

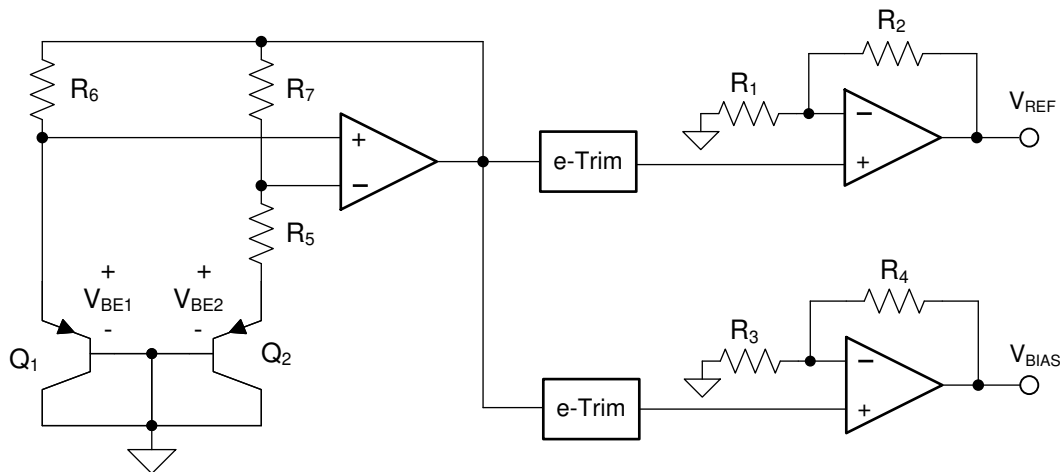
8 詳細説明

8.1 概要

REF20xx は、デュアル出力の V_{REF} および V_{BIAS} ($V_{REF} / 2$) バンドギャップ電圧リファレンスの製品ファミリーです。セクション 8.2 に、基本的なバンドギャップトポロジと、 V_{REF} および V_{BIAS} 出力の生成に使用される 2 つのバッファのブロック図を示します。トランジスタ Q_1 および Q_2 は、 Q_1 の電流密度が Q_2 の電流密度より高くなるようにバイアスされます。2 つベースエミッタ電圧の差 ($V_{BE1} - V_{BE2}$) は、正の温度係数を持ち、抵抗 R_5 の両端に印加されます。この電圧が増幅され、負の温度係数を持つ Q_2 のベースエミッタ電圧に加算されます。その結果、バンドギャップ出力電圧は温度にほとんど依存しません。2 つの独立したバッファを使用して、バンドギャップ電圧から V_{REF} および V_{BIAS} を生成します。抵抗 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 のサイズは、 $V_{BIAS} = V_{REF}/2$ になるように設定されます。

e-Trim™ は、 V_{REF} および V_{BIAS} の初期精度および温度係数に対するパッケージレベルのトリム手法で、プラスチック成形プロセス後の製造の最終段階で実行されます。e-Trim 方式は、トランジスタの本質的な特性の不一致や、パッケージの形成時に発生する誤差を最小限に抑えます。REF20xx には e-Trim が実装されており、 V_{REF} と V_{BIAS} 出力の両方で温度ドリフトを最小限に抑え、初期精度を最大限に高めています。

8.2 機能ブロック図



8.3 機能説明

8.3.1 V_{REF} と V_{BIAS} のトラッキング

ほとんどの単一電源システムでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、A/D コンバータ (ADC) 入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx の V_{REF} および V_{BIAS} 出力は、セクション 8.2 に示すものと同じバンドギャップ電圧から生成されます。したがって、両方の出力は $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ の全動作温度範囲にわたって精度 $7\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値) で互いにトラッキングします。温度範囲が $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ に制限されると、トラッキングの精度は $6\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ (最大値) に向上します。トラッキング誤差は、式 2 のボックス法を使用して計算されます。

$$\text{Tracking Error} = \left(\frac{V_{\text{DIFF}}[\text{MAX}] - V_{\text{DIFF}}[\text{MIN}]}{V_{\text{REF}} \times \text{Temperature Range}} \right) \times 10^6 (\text{ppm}) \quad (2)$$

ここで、

$$V_{\text{DIFF}} = V_{\text{REF}} - 2 \times V_{\text{BIAS}} \quad (3)$$

図 8-1 に、トラッキング精度を示します。

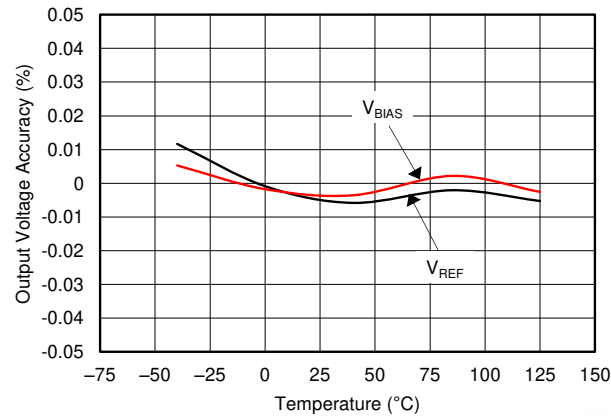


図 8-1. V_{REF} および V_{BIAS} のトラッキングと温度との関係

8.3.2 低温度ドリフト

REF20xx はドリフト誤差が最小限になるように設計されています。ドリフト誤差は、温度に対する出力電圧の変化として定義されます。ボックス法によるドリフトの計算には、式 4 を使用します。

$$\text{Drift} = \left(\frac{V_{\text{REF}}[\text{MAX}] - V_{\text{REF}}[\text{MIN}]}{V_{\text{REF}} \times \text{Temperature Range}} \right) \times 10^6 (\text{ppm}) \quad (4)$$

8.3.3 負荷電流

REF20xx ファミリーは、出力ごとに $\pm 20\text{mA}$ の電流負荷を供給するように規定されています。デバイスの V_{REF} および V_{BIAS} 出力は、出力短絡電流を 50mA に制限することで短絡から保護されています。デバイスの温度は、式 5 に従って上昇します。

$$T_J = T_A + P_D \times R_{\theta JA} \quad (5)$$

ここで、

- T_J は接合部温度 (°C)
- T_A は周囲温度 (°C)
- P_D は電力損失 (W)
- R_{θJA} は接合部から周囲への熱抵抗 (°C/W)

REF20xx の最大接合部温度が絶対最大定格の 150°C を超えないことを確認してください。

8.4 デバイスの機能モード

REF20xx の EN ピンが High になると、デバイスはアクティブ モードになります。通常動作中は、デバイスはアクティブ モードです。REF20xx は、ENABLE ピンを「Low」にすることで、ローパワー モードに設定できます。シャットダウン モードでは、デバイスの出力がハイ インピーダンスになり、デバイスの静止電流が 5μA に減少します。ロジック High およびロジック Low 電圧レベルについては、セクション 6.5 を参照してください。

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 使用上の注意

このセクションのソリューションは、 $-2.5\text{A} \sim 2.5\text{A}$ の負荷電流を正確に検出し、以下の特長を備えています。

- 低ドリフト
- 双方向
- 単電源
- ローサイド
- 電流検出

出力のリニアな動作範囲は $250\text{mV} \sim 2.75\text{V}$ です。正の電流は、 $1.5\text{V} \sim 2.75\text{V}$ の出力電圧で表されます。負の電流は、 $250\text{mV} \sim 1.5\text{V}$ の出力電圧で表されます。差動アンプは [INA213](#) 電流シャント モニタであり、低ドリフトの REF2030 から電源とリファレンス電圧が供給されます。

腐食性環境で電子機器を使用する産業用アプリケーションは、熱、湿気、腐食性ガスにさらされることにより、腐食性損傷の影響を受けやすくなります。特定のシステムで次の条件を組み合わせると、腐食性損傷のリスクが高まります。

1. 通気性の筐体で PCB が露出している。
2. PCB に絶縁保護コーティングが施されていない。
3. 露出リードの部品が腐食の影響を受けやすいメッキで処理されている。
4. RoHS 適合のためメッキ技術が変更された (例: 一部のメッキでは **Pb** (鉛) が除去されたものがある)。

過酷な環境での腐食に対する耐性を向上させるため、REF2025AISDDCR は改良されたアセンブリ プロセスを採用した無光沢 Sn メッキを採用し、Cu (銅) の露出を低減することにより、Battelle クラス III および同様の過酷な環境での耐腐食性を向上させています。型番の「S」は、特殊メッキ オプションを示します。「S」の無い REF2025 バージョンは、業界標準の NiPdAu 処理技法で引き続き利用できます。

9.2 代表的なアプリケーション

9.2.1 ローサイド電流センシング アプリケーション

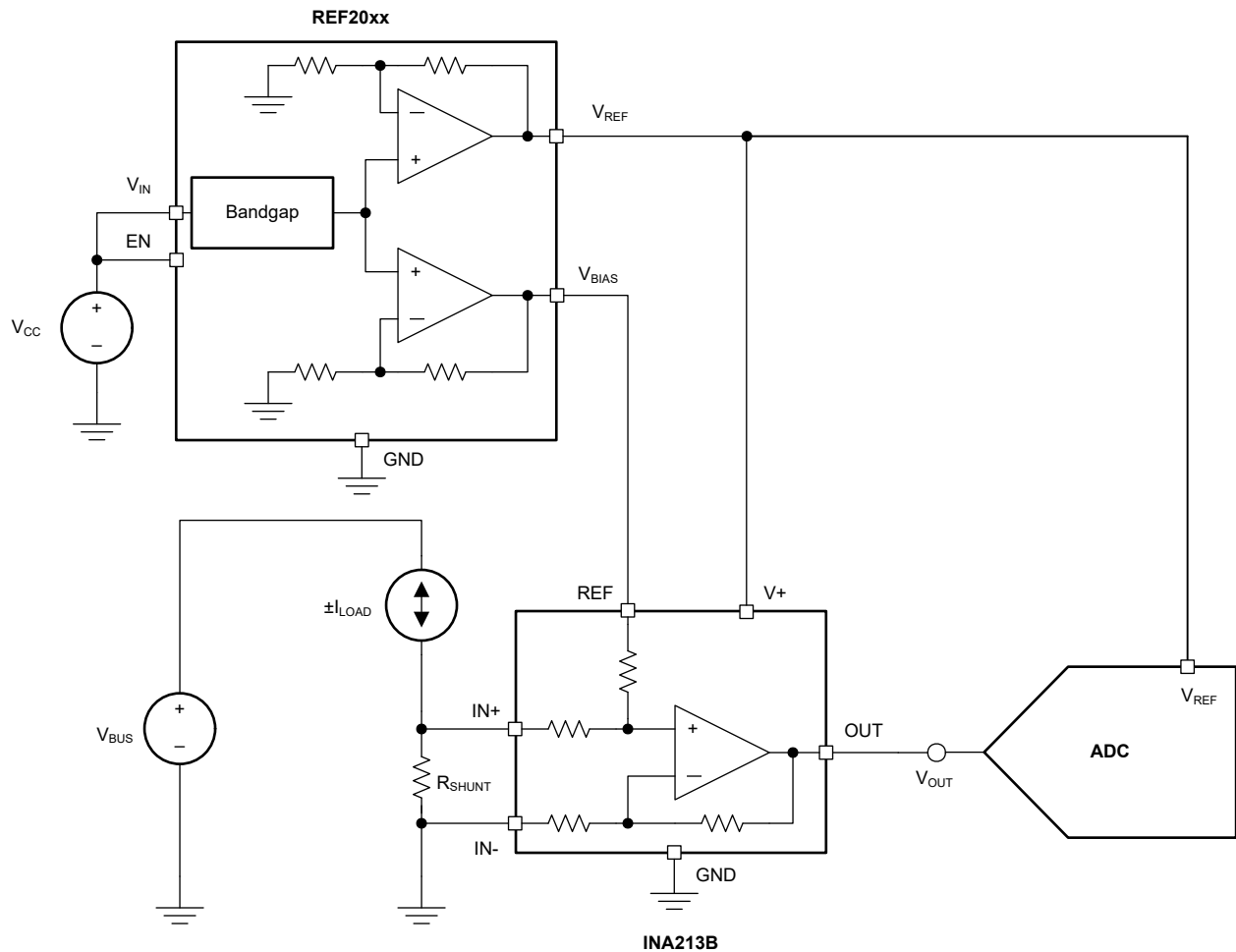


図 9-1. ローサイド電流センシング アプリケーション

9.2.1.1 設計要件

設計要件は次のとおりです。

1. 電源電圧: 5.0V
2. 負荷電流: $\pm 2.5A$
3. 出力: 250mV ~ 2.75V
4. 最大シャント電圧: $\pm 25mV$

9.2.1.2 詳細な設計手順

同相電圧がグラウンド付近にあるため、ローサイド電流センシングが推奨されます。そのため、電流センシングソリューションは、バス電圧 V_{BUS} から独立しています。双方向電流をセンシングする場合は、基準ピン付きの差動アンプを使用します。この手順では、負の入力電圧にตอบสนองするように出力段をバイアスすることで、正と負の電流が区別できるようになります。差動アンプに電源 ($V+$) と基準電圧 (V_{REF} または V_{BIAS}) を供給するには、さまざまな方法があります。低ドリフトソリューションでは、電源と基準電圧の両方を供給するモノリシック基準を使用します。図 9-2 に、低ドリフト、ローサイド、双方向の電流検出ソリューションの一般的な回路トポロジを示します。この一般的な回路トポロジは、ADC とのインターフェイスに特に有益です。図 9-1 を参照してください。 V_{REF} と V_{BIAS} は、他のトポロジよりも優れた特性の一致を示しながら、温度

範囲全体にわたってトラッキングします。設計手順の詳細なバージョンについては、『[低ドリフト、双方向、単一電源、ローサイド電流検出](#)』リファレンス デザインを参照してください。

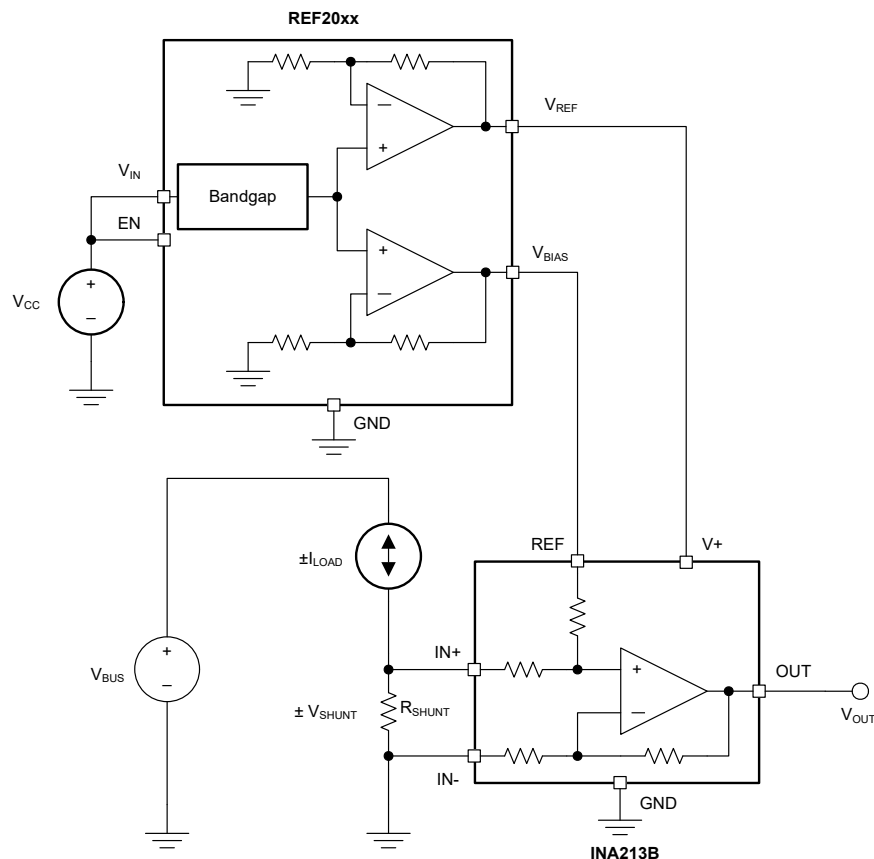


図 9-2. 低ドリフト、ローサイド、双方向、電流検出回路トポロジ

図 9-2 に示す回路の伝達関数を式 6 に示します。

$$V_{OUT} = G \times (\pm V_{SHUNT}) + V_{BIAS} = G \times (\pm I_{LOAD} \times R_{SHUNT}) + V_{BIAS} \quad (6)$$

9.2.1.2.1 ショント抵抗

図 9-2 は、 V_{SHUNT} の値をシステム負荷のグランド電位として示します。 V_{SHUNT} の値が大きすぎると、グランド電位が 0V のシステムと接続する際に問題が発生する可能性があります。 V_{SHUNT} の値が負になりすぎると、接続で問題が発生する可能性に加えて、差動アンプの入力同相電圧の許容範囲を超過する可能性があります。そのため、ショント抵抗の両端の電圧を制限することが重要です。 R_{SHUNT} の値の計算には、式 7 を使用します。

$$R_{SHUNT(max)} = \frac{V_{SHUNT(max)}}{I_{LOAD(max)}} \quad (7)$$

最大ショント電圧が $\pm 25\text{mV}$ 、負荷電流範囲が $\pm 2.5\text{A}$ であるとする、最大ショント抵抗の計算には式 8 を使用します。

$$R_{SHUNT(max)} = \frac{V_{SHUNT(max)}}{I_{LOAD(max)}} = \frac{25\text{mV}}{2.5\text{A}} = 10\text{m}\Omega \quad (8)$$

温度範囲全体にわたる誤差を最小限に抑えるため、低ドリフトのショント抵抗を選択します。オフセット誤差を最小にするには、許容誤差が最小のショント抵抗を選択します。この設計では、Y14870R01000B9W 抵抗を使用します。

9.2.1.2.2 差動アンプ

この設計で使用する差動アンプが、以下の機能を備えていることを確認してください。

1. 単一電源 (3V)
2. 入力基準電圧
3. 低初期入力オフセット電圧 (V_{OS})
4. 低ドリフト
5. 固定ゲイン
6. ローサイド センシング (入力同相範囲がグラウンド未満)

この設計では、電流シャント モニタ (INA213) を使用します。図 9-3 に、INA21x ファミリのトポロジを示します。INA213B の仕様は、『[INA21x 電圧出力、ロー / ハイサイド測定、双方向、ゼロドリフト シリーズ、電流シャント モニタ](#)』データシートで確認できます。

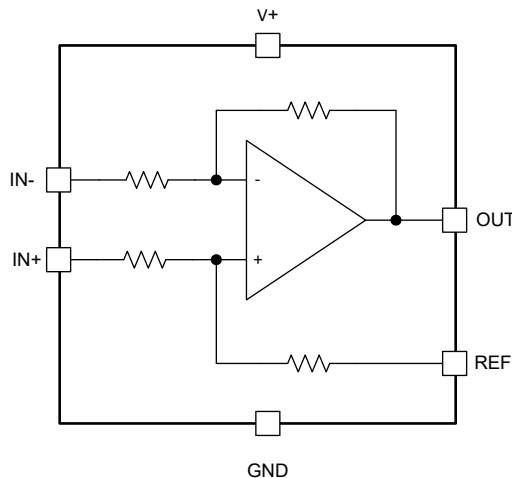


図 9-3. INA21x 電流シャント モニタ トポロジ

INA213B は、必要な機能がすべて含まれているため、このアプリケーションに最適です。一般的に、計測アンプ (INA) には、このアプリケーションに不可欠なグラウンドまでの入力同相スイングがありません。さらに、INA にはゲインを設定するために外付け抵抗が必要ですが、これは低ドリフト アプリケーションには望ましくありません。差動アンプは通常、入力バイアス電流が大きいので、小さな負荷電流ではソリューションの精度が低下します。差動アンプのゲインは通常 $1V/V$ です。ゲインが調整可能な場合、これらのアンプは低ドリフト アプリケーションには適さない外付け抵抗を使用します。

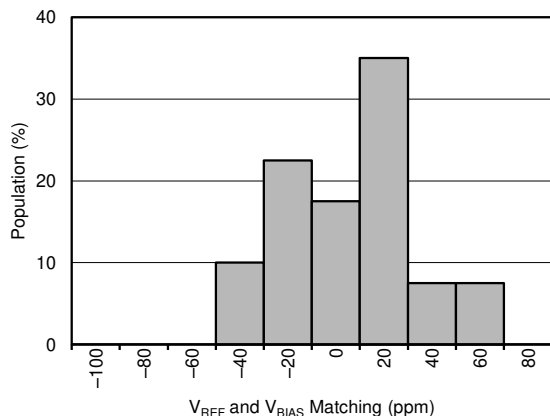
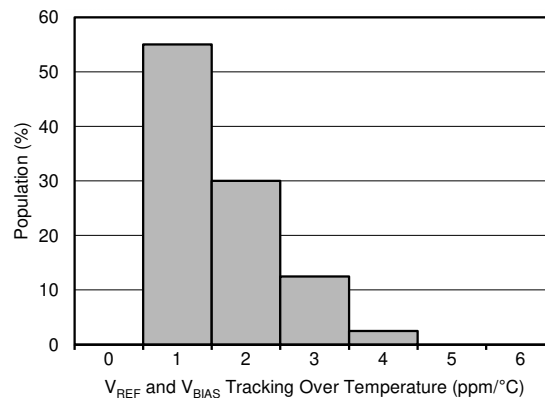
9.2.1.2.3 電圧リファレンス

このアプリケーションの電圧リファレンスに、以下の機能が備わっていることを確認します。

1. デュアル出力 (3.0V および 1.5V)
2. 低ドリフト
3. 2 つの出力間のトラッキング誤差が小さい

この設計では、REF2030 を使用します。REF20xx のトポロジは、[セクション 8.2](#) に示すとおりです。

REF2030 はデュアル出力であるため、このアプリケーションに最適です。8ppm/°C の温度ドリフト、0.05% の初期精度により、このアプリケーションでの電圧リファレンスからの誤差は最小限に抑えられます。さらに、[図 9-4](#) および [図 9-5](#) に示すように、2 つの出力間の特性不一致は最小限であり、両方の出力は温度範囲全体にわたって優れたトラッキングをします。

図 9-4. $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ の分布 ($T_A = 25^\circ\text{C}$ にて)図 9-5. 温度範囲全体にわたる $V_{REF} - 2 \times V_{BIAS}$ ドリフト
トラッキングの分布

9.2.1.2.4 結果

表 9-1 に測定結果をまとめます。

表 9-1. 測定結果

エラー	キャリブレーションなし (%)	キャリブレーションあり (%)
全負荷電流範囲 (25°C) での誤差	± 0.0355	± 0.004
全負荷電流範囲 (-40°C ~ 125°C) での誤差	± 0.0522	± 0.0606

9.2.1.3 アプリケーション曲線

25°C で 2 点キャリブレーションを実行すると、オフセット電圧やゲイン誤差などに関連する誤差が除去されます。図 9-6、図 9-7 および 図 9-8 に、さまざまな条件で測定された誤差を示します。測定手順、較正、および計算の詳細な説明については、『低ドリフト、双方向、単一電源、ローサイド電流検出設計』リファレンスガイドを参照してください。

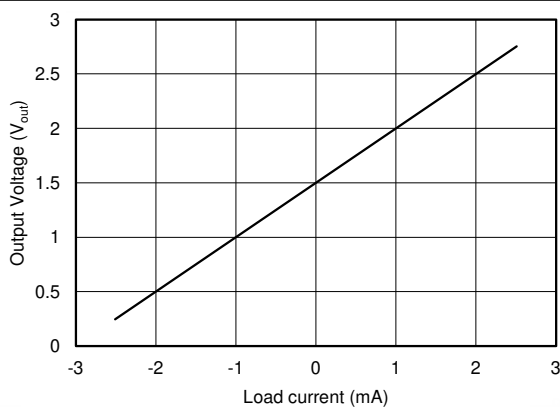
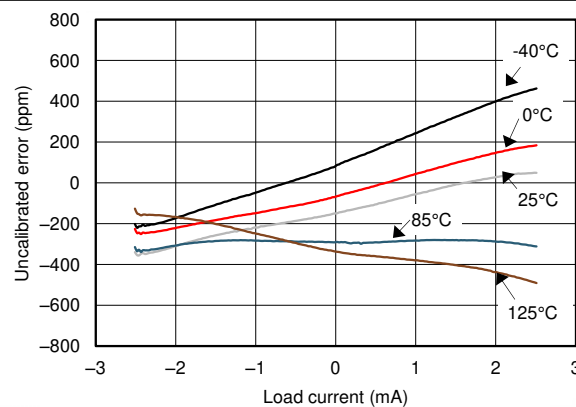


図 9-6. 測定された伝達関数

図 9-7. キャリブレーションなしの誤差と負荷電流との
関係

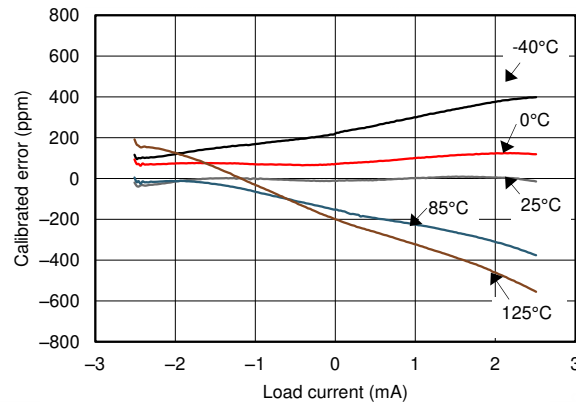


図 9-8. キャリブレーション済みの誤差と負荷電流との関係

9.3 電源に関する推奨事項

REF20xx ファミリのリファレンスは、非常に低いドロップアウト電圧を特長としています。REF20xx ファミリのリファレンスは、出力電圧より 20mV のみ上回る電源で動作します。負荷ありのリファレンス条件については、標準的なドロップアウト電圧と負荷プロットを図 9-9 に示します。0.1μF ~ 10μF の範囲の電源バイパス コンデンサの使用を推奨します。

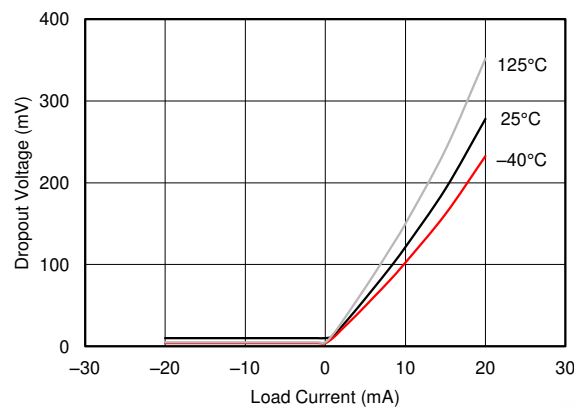


図 9-9. ドロップアウト電圧と負荷電流との関係

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

図 9-10 に、REF2030 を使用したデータ アクイジション システムの PCB レイアウトの例を示します。主な検討事項は次のとおりです。

- REF2030 の V_{IN} 、 V_{REF} 、および V_{BIAS} に、低 ESR、0.1μF のセラミック バイパス コンデンサを接続します。
- デバイスの仕様に従って、システム内の他のアクティブ デバイスをデカップリングします。
- ベタグランド プレーンを使用すると、熱の分散に役立ち、電磁干渉 (EMI) ノイズを拾いにくくなります。
- 外付け部品は、可能な限りデバイスに近く配置します。この構成により、寄生誤差 (ゼーバック効果など) の発生を防止できます。
- INA および ADC へのバイアス接続とリファレンス電圧の間のパターン長を最小限に抑えて、ノイズのピックアップを低減します。
- デジタル パターンと並行して敏感なアナログ パターンを配線しないでください。デジタル パターンとアナログ パターンはできるだけ交差しないようにします。どうしても必要な場合には、直角に交差させます。

9.4.2 レイアウト例

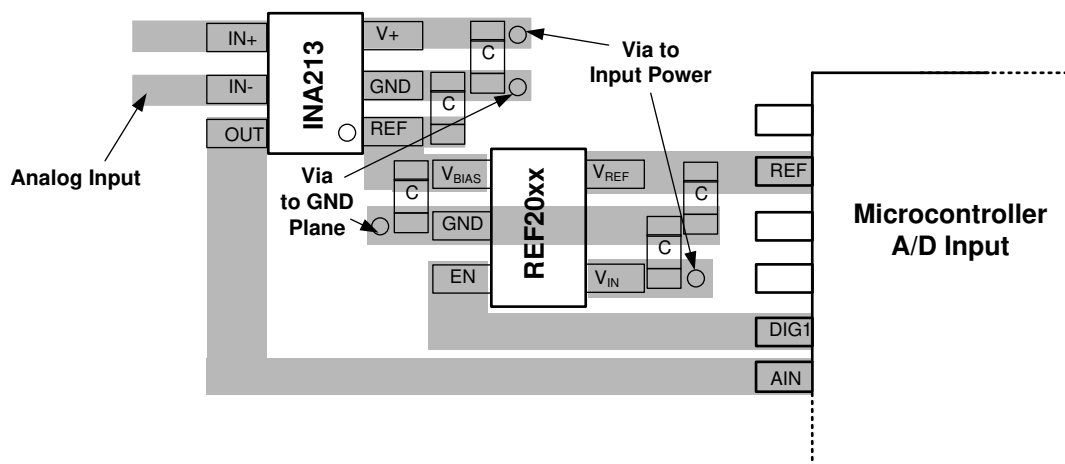


図 9-10. レイアウト例

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 ドキュメントのサポート

10.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス インスツルメンツ、『[INA21x 電圧出力、ロー / ハイサイド測定、双方向、ゼロドリフト シリーズ、電流シャント モニタ](#)』データシート
- テキサス インスツルメンツ、『[低ドリフト、双方向、単一電源、ローサイド電流検出設計](#)』リファレンス設計
- テキサス インスツルメンツ、『[半導体および IC パッケージの熱評価指標](#)』アプリケーション ノート

10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.3 サポート・リソース

[テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

10.4 商標

e-Trim™ and テキサス・インスツルメンツ E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision E (January 2022) to Revision F (June 2026)	Page
• REF2025、REF2030、REF2033、REF2041 の各デバイスを TI.com の REF20 製品フォルダに移動し、データシートのヘッダを更新.....	1
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1

Changes from Revision D (May 2018) to Revision E (January 2022)	Page
• 「アプリケーション」セクションを更新.....	1
• ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新.....	1

• 「ESD レーティング」表を変更、HBM レーティングを $\pm 4000\text{V}$ から $\pm 2500\text{V}$ に変更	5
• 長期安定性の値を更新.....	6
• 「パラメータ測定情報」セクションに「長期安定性」サブセクションを追加.....	16

12 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月